

=====

МЕТОД РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО
АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ.
АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ
Терміни та визначення
Видання офіційне
ДЕРЖКОММІСТОВУДУВАННЯ УКРАЇНИ
КИЇВ

ДСТУ Б А.1.1-8-94

Передмова

- 1 РОЗРОБЛЕНО
Українським науково-дослідним та
проектно-конструкторським інститутом
будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)
- 2 ВНЕСЕНО
Управлінням державних нормативів і стандартів
Мінбудархітектури України
- 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказом Міністерства України у справах
будівництва та архітектури від 12.04.94 р. М 83.
- 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Цей стандарт не може бути повністю або частково
відтворений, тиражований та розповсюджений без
дозволу Мінбудархітектури України

ДСТУ Б А.1.1-8-94

ЗМІСТ

	С.
1 Галузь використання.....	1
2 Нормативні посилання	2
3 Основні положення	2
4 Загальні поняття	3
4.1 Апаратура для рентгеноструктурного аналізу	3
4.2 Основні параметри та характеристики апаратів для рентгеноструктурного аналізу	5
4.3 Складові частини та пристрої	9
4.4 Основні методи рентгеноструктурного аналізу ...	12
Абетковий показчик українських термінів	19
Абетковий показчик німецьких термінів	21
Абетковий показчик англійських термінів	23
Абетковий показчик французьких термінів	25
Абетковий показчик російських термінів	27

ДСТУ Б А.1.1-8-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

=====

МЕТОД РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО
АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ.
АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ
Терміни та визначення
МЕТОД РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО
АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ.
АПАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Термины и определения
METHOD OF X-RAY ANALYSIS MATERIALS.
INSTRUMENTATION EXECUTION
Terms and definitions

Чинний від 1994-10-01

- 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
- 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять
методу рентгеноструктурного аналізу.
- 1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові
для використання в усіх видах нормативної документації, у

довідковій та навчально-методичній літературі, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

Видання офіційне

- 2 -

ДСТУ Б А.1.1-18-94

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України.
| Порядок розроблення державних стандартів

ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України.
| Загальні вимоги до побудови, викладу,
| оформлення та змісту стандартів

КНД 50-011-93 | Основні положення та порядок розроблення
| стандартів на терміни та визначення
|

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Побудова, виклад та оформлення стандарту відповідають вимогам ДСТУ 1.0, ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.5, КНД 50-011.

3.2 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.3 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.4 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

- 3 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1 АПАРАТУРА ДЛЯ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ

4.1.1 рентгенівський дифрактометр

de	R[ol]ntgendiffraktometer	*
en	X-ray diffraktometer	
fr	diffraktom[e2]tre [a4]	*
	rayons X	
ru	рентгеновский дифрактометр	

Апарат, у якому для реєстрації, інтенсивності дифрагованих рентгенівських променів застосовуються лічильники квантів з реєструвальними електронними схемами та записом результатів на діаграмній стрічці або цифродрукувальному пристрої

Аппарат, в котором для регистрации интенсивности дифрагированных рентгеновских лучей применяются счетчики квантов с регистрирующими электронными схемами и записью результатов на диаграммной ленте или цифроречательном устройстве

4.1.2 дифрактометр загального призначення

de	Allgemeinweckdiffraktometer	
en	general purpose diffraktometer	
fr	diffraktom[e2]tre d'usage	*

		gen[e2]ral	*
		ru дифрактометр общего на- значения	
	Апарат для проведення широкого кола рентгеноструктурних досліджень матеріалів із застосуванням іонізаційного методу реєстрації рентгеновських променів	Апарат для проведения широкого круга рентгеноструктурных исследований материалов с использованием ионизационного метода регистрации рентгеновских лучей	
4.1.3	текстурний рентгеновський дифрактометр	de Texturr[ol]ntgendiffrakto- meter	*
		en texture X-ray diffraktometer	
		fr diffraktom[e2]tre de texture [a4] rayons X	* *
		ru текстурный рентгеновский дифрактометр	
	Рентгеновський дифрактометр, який застосовується для дослідження текстур	Рентгеновский дифрактометр, предназначенный для исследования текстур	
4.1.4	малокутовий рентгеновський дифрактометр	de Kleinwinkelr[ol]ntgendif- fraktometer	*
		en small angle X-ray diffrakto- meter	
		fr diffraktom[e2]tre [a4]	*
		ДСТУ Б А.1.1-8-94	
		rayons X [a4] petits angles	*
		ru малоугловой рентгеновский дифрактометр	
	Апарат для вивчення дифузного та дискретного розсіювання рентгеновських променів субмікроскопічними (від 0,5 до 100 нм) неоднорідностями у речовинах, а також у матеріалах з великими (до 1000 А) періодами кристалічної ґратки	Апарат для изучения диффузного и дискретного рассеивания рентгеновских лучей субмикроскопическими (от 0,5 до 100 нм) неоднородностями в веществах, а также в материалах с большими (до 1000 А) периодами кристаллической решетки	
4.1.5	рентгеновський спектрометр	de R[ol]ntgenspektrometer	*
		en X-ray spektrometer	
		fr spectrom[e2]tre [a4] rayons X	* *
		ru рентгеновский спектрометр	
	Спектрометр іонізуючих випромінювань для дослідження спектра величин, що характеризують поле рентгеновського випромінювання	Спектрометр ионизирующих излучений для исследования спектра величин, характеризующих поле рентгеновского излучения	
4.1.6	кристал - дифракційний рентгеновський спектрометр	de Gamma-Kristallspektrometer	
		en crystal diffraction X-ray spectrometer	
		fr spectrom[e2]tre de diffrac- tion [a4] cristal [a4] rayons X	* *
		ru кристалл - дифракционный рентгеновский спектрометр	
	Рентгеновський спектрометр, у якому для дослід-	Рентгеновский спектрометр, в котором для иссле-	

	ження спектра використовується дифракція випромінювання на кристаланалізаторі	довання спектра використовується дифракція излучения на кристалланализаторе	
4.1.7	рентгенівський аналітичний комплекс	de R[ol]ntgenanalysenkomplex en X-ray analytical complex fr complexe analytique [a4] rayons X	* *
	Комплекс апаратури для автоматичного проведення рентгеноспектрального аналізу, який складається з рентгенівського спектрометра та ЕОМ	ru рентгеновский аналитический комплекс Комплекс аппаратуры для автоматического проведения рентгеноспектрального анализа, состоящий из рентгеновского спектрометра и ЭВМ	
			- 5 -
			ДСТУ Б А.1.1-8-94
	4.2 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРАТІВ ДЛЯ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ		
4.2.1	основна апаратурна похибка	de Ger[al]tefehler en main instrumental error fr erreur principale due aux instruments ru основная аппаратурная погрешность	*
	Відносне середнє квадратичне відхилення результатів випромінювання щільності потоку рентгенівського випромінювання	Относительное среднеквадратическое отклонение результатов измерения плотности рентгеновского излучения	
4.2.2	Допустиме відхилення кута повороту блоку детектування	de Zul[al]ssige Abweichung des Drehwinkels des Gleichrichtungsblockes en turning angle admissible deviation of the detection block fr d[e2]viation angulaire admissible du bloc de d[e2]-tection	* *
	Відхилення дійсного значення кута повороту блоку від значення, заданого методикою контролю	ru допустимое отклонение угла поворота блока детектирования Отклонение действительного значения угла поворота от значения, заданного методикой контроля	
4.2.3	діапазон кутових переміщень	de Winkelverschiebungsbereich en range of angular displacements fr gammedesd[e2]placementsangulaires	* *
	Ділянка кутових переміщень, для якої визначене допустиме відхилення	ru диапазон угловых перемещений Область угловых перемещений, для которой определено допустимое отклонение	
4.2.4	діапазон переміщення рентгенівської трубки	de R[ol]ntgenr[ol]hreverschiebungsbereich en displacement range of X-ray tube fr gamme de d[e2]placement d'un	* *

tube radiog[e2]ne *
 ru диапазон перемещения рентгеновской трубки

- 6 -

		ДСТУ Б А.1.1-8-94	
	Ділянка кутових перемі- щень рентгенівської трубки, обмежена почат- ковим та кінцевим зна- ченням шкали	Область угловых перемеще- ний рентгеновской трубки, ограниченная начальными и конечными значениями шкалы	
4.2.5	установочна швидкість	de Beharrungsgeschwindigkeit en regulation speed fr vitesse de r[e2]glage * ru установочная скорость	
	Встановлена швидкість кутового переміщення блоку детектування	Установленная скорость углового перемещения бло- ка детектирования	
4.2.6	діапазон робочих кутів гоніометричної при- ставки	de Pr[ul]fwinkelbereich des metrischen Vorsatzger[al]tes * en working angle range of a metric adapter * fr gamme des angles de travail d'un adapteur m[e2]trique *	
	Ділянки робочих кутів, у якій реєструється рент- генівське випроміню- вання	Область рабочих углов, в которой регистрируется рентгеновское излучение	
4.2.7	похибка кутового пристрою	de Winkelfehler en angular bloc error fr erreur d'un bloc angulaire ru погрешность углового ус- тройства	
	Відхилення дійсного ку- тового місцезнаходжен- ня кристалотримача від заданого значення	Отклонение действитель- ного углового положения кристаллодержателя от за- данного значения	
4.2.8	похибка вимірювання кута повороту	de Drehwinkelmeßfehler en measurement error of a rotation angle fr erreur de mesurage d'un angle de rotation ru погрешность измерения угла поворота	
	Відхилення дійсного зна- чення кута повороту кристалотримача від за- даного значення	Отклонение действительно- го значения угла поворота кристаллодержателя от за- данного значения	
4.2.9	кутова роздільність	de Winkelauf[l]sung (Winke- laufteilung) * en angular resolution fr r[e2]solution angulaire * ru угловое разрешение	
	Мінімальний кут ди- фракції рентгенівського випромінювання, при якому воно відрізняєть- ся від фону	Минимальный угол дифрак- ции рентгеновского излуче- ния, при котором оно раз- лично от фона	
4.2.10	діапазон повороту досліджуваного зразка	de Pr[ul]fk[ol]rperdbereich * en rotation range of a testing sample	

- 7 -

		fr gamme de rotation d'un [e2]chantillon [a4] [e2]tudier *
		ru диапазон поворота исследуемого образца *
	Ділянка зміни кута нахилу в текстурній приставці	Область изменения угла наклона в текстурной приставке
4.2.11	робоча площа вхідного вікна детектора	de Detektoreingangs[ol]ffnungsarbeitsfl[al]che *
		en input window working area of the detector *
		fr surface utile de la lucarne d'entr[e2]e du d[e]tecteur *
		ru рабочая площадь входного окна детектора *
	Площа, яка забезпечує попадання квантів рентгенівського випромінювання всередину робочого об'єму детектора	Площадь, обеспечивающая попадание квантов рентгеновского излучения внутрь рабочего объема детектора
4.2.12	швидкість лічення імпульсів на аналітичній лінії	de Analysenleitungsimpulszahlungsgeschwindigkeit *
		en coating rate of impulses on analytical line *
		fr cadence de comptage des impulsions sur ligne analytique *
		ru скорость счета импульсов на аналитической линии *
	Швидкість лічення імпульсів на виході реєструвального пристрою, який налагоджений на дану аналітичну лінію	Скорость счета импульсов на выходе регистрирующего устройства, настроенного на данную аналитическую линию
4.2.13	контрастність рентгенівського дифрактометра	de R[ol]ntgendiffraktometerkontrast *
		en contrast of a X-ray diffractometer *
		fr contraste d'un diffractom[e2]tre [a4] rayons X *
		ru контрастность рентгеновского дифрактометра *
- 8 -		
		ДСТУ Б А.1.1-8-94
	Відношення вихідного сигналу без фону на зразку з відомим вмістом елемента, що визначається, до вихідного сигналу, який не містить елемента, що визначається	Отношение выходного сигнала без фона на образце с известным содержанием определяемого элемента к выходному сигналу на образце, не содержащем определяемого элемента
4.2.14	межа виявлення	de Nachweisbarkeitsgranze *
		en detection limit *
		fr limite de d[e2]tection *
		ru предел обнаружения *
	Найменший вміст елемента, визначеного розрахунковим способом, який може бути виявлений за встановленою методикою	Наименьшее содержание определяемого расчетным способом элемента, которое может быть обнаружено по установленной методике
4.2.15	кут відбору рентгенівського випромінювання	de Winkelstrahlungsauswahlwinkel *
		en angle of extraction of the X-radiation *

		fr angle d'extraction de la radiation X	
		ru угол отбора рентгеновского излучения	
	Кут між площиною, дотичною до випромінюючої поверхні, і напрямком відбору рентгенівського випромінювання	Угол между плоскостью, касательной к излучающей поверхности, и направлением отбора рентгеновского излучения	
4.2.16	діапазон аналізуючих хімічних елементів	de Bereich der gepr[ul]tten chemischen Elemente	*
		en range of the analysed chemical elements	
		fr gamme des [e2]lements chimiques [a4] analyser	*
		ru диапазон анализирующих химических элементов	*
	Ділянка хімічних елементів із гранично малими та гранично великими атомними номерами, в якій вони можуть бути визначені	Область химических элементов с предельно малым и предельно большим атомными номерами, в которой они могут быть определены	
4.2.17	спектральна роздільність	de Spektralaufteilung	
		en spectral resolution	
		fr r[e2]solution spectrale	
		ru спектральное расширение	
	Найменша відстань між двома суміжними максимумами, які спостерігаються над фоном	Наименьшее расстояние между двумя соседними максимумами, наблюдаемыми над фоном	
- 9 -			
			ДСТУ В А.1.1-8-94
4.2.18	мінімальний крок сканування	de Mindestabtastungsschritt	
		en minimum step of scanning	
		fr pas minimal de balayage	
		ru минимальный шаг сканирования	
	Найменший кут повороту або найменше лінійне переміщення елементів спектрометричного пристрою	Наименьший угол поворота или наименьшее линейное перемещение элементов спектрометрирующего устройства	
4.2.19	вибір випромінювання	de Strahlungsauswahl	
		en radiation sampling	
		fr choix de radiation	
		ru выбор излучения	
	Вибір випромінювання рентгенівської трубки, при якому відстань між двома відбиттями, що реєструються, тим більша, чим більша довжина хвилі випромінювання	Выбор излучения рентгеновской трубки, при котором расстояние между двумя регистрируемыми отражениями тем больше, чем больше длина волны излучения	
4.3 СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА ПРИСТРОЇ			
4.3.1	рентгенівський спектрометричний канал	de R[ol]ntgenspektrometerkanal	*
		en spectrometric X-ray channel	
		fr canal spectrom[e2]trique [a4] rayons X	*
		ru рентгеновский спектрометрический канал	
	Частина пристрою, яка забезпечує відокремлення і реєстрацію виб-	Часть устройства, обеспечивающая выделение и регистрацию выбранного участ-	

4.3.2	раної ділянки спектра фіксований рентгенів- ський спектрометрич- ний канал	ка спектра de Fixierr[ol]ntgenspektrometer- * kanal en fixed spectrometric X-ray channel fr canal spectrom[e2]trique, * fixe rayons X ru фиксированный рентгенов- ский спектрометрический канал
4.3.3	Канал для відокремлен- ня і реєстрації заздале- гідь вибраної ділянки рентгенівського спектра сканувальний рентге- нівський спектромет- ричний канал	Канал для выделения и ре- гистрации заранее выбран- ного участка рентгеновско- го спектра de Ahtastungs[r[ol]ntgenspektro- * meterkanal en scanning spectrometric X-ray channel
- 10 -		
		ДСТУ В А.1.1-8-94
4.3.4	Канал з автоматичною передбудовою ділянок спектра і з можливістю його запису рентгенівська гоніо- метрична приставка	Канал с автоматической перестройкой участков спектра и с возможностью его записи de R[ol]ntgengoniometervorsatz- * ger[al]t * en X-ray goniometry adaptor * fr adapteur goniom[e2]trique * [a4] rayons X * ru рентгеновская гониометри- ческая приставка
4.3.5	Приставка, яка забезпе- чує усереднення кри- сталів обертанням зраз- ка у власній площині рентгенівська камера	Приставка, обеспечиваю- щая усреднение кристаллов вращением образца в со- бственной плоскости de R[ol]ntgenkamera * en X-ray camera fr chambre de diffraction ru рентгеновская камера
4.3.6	Прилад для реєстрації на рентгенівську плівку диф- рагованого рентгенів- ського випромінювання детектор рентгенівсько- го випромінювання	Прибор для регистрации на рентгеновскую пленку диф- рагированного рентгенов- ского излучения de R[ol]ntgenstrahlungsdetektor * en X-ray radiation detector * fr d[e2]tecteur de radiation X ru детектор рентгеновского излучения
4.3.7	Перетворювач квантів рентгенівського випро- мінювання в імпульси напруги або струму детектор телевізійного типу	Преобразователь квантов рентгеновского излучения в импульс напряжения или тока de Fernsehdetektor en television type detector * fr d[e2]tecteur de type-tele- * vision ru детектор телевизионного типа
	Прилад для одержання	Прибор для получения дву-

4.3.8	двоімірної дифракційної картини на телеекрані кристал-аналізатор	de	мерной дифракционной картины на телеэкране Kristallanalysator	
		en	crystal-analyser	
- 11 -				
			ДСТУ Б А.1.1-8-94	
		fr	cristal analyseur	
		ru	кристалл-анализатор	
4.3.9	Крістал - дифракційний диспергувальний елемент для розкладання в спектр рентгенівського випромінювання і відокремлення заданого спектрального інтервалу кристал-монохроматор	de	Кристалл-дифракционный диспергирующий элемент для разложения в спектр рентгеновского излучения и выделения заданного спектрального интервала Kristallmonochromator	
		en	crystal-monochromator	
		fr	cristal-monochromateur	
		ru	кристалл-монохроматор	
4.3.10	Елемент для монохроматизації рентгенівського випромінювання рентгевівський фільтр	de	Элемент для монохроматизации рентгеновского излучения R[ol]ntgenfilter	*
		en	X-ray filter	
		fr	filtre [a4] rayons X	*
		ru	рентгеновский фильтр	
4.3.11	Фільтр із поглинального матеріалу, призначений для послаблення або зміни спектрального складу випромінювання джерело рентгенівського випромінювання	de	Фильтр из поглощающего материала, предназначенный для ослабления или изменения спектрального состава излучения R[ol]ntgenstrahlungsquelle	*
		en	source of X-ray radiation	
		fr	source de rayonnement	
		ru	источник рентгеновского излучения	
4.3.12	Сукупність пристроїв, які забезпечують одержання рентгенівського випромінювання з заданими параметрами комплекс керуючий дифрактометричний	de	Совокупность устройств, обеспечивающих получение рентгеновского излучения с заданными параметрами Difraktometersteuerranlage	
		en	diffraction control complex-KYD	
		fr	complexe de commande diffractom[e2]trigue	*
		ru	комплекс управляющий дифрактометрический	
	Комплекс для програмного керування, збору, обробки і реєстрації інформації		Комплекс для программного управления, сбора, обработки и регистрации информации	
- 12 -				
			ДСТУ Б А.1.1-8-94	
4.4	ОСНОВНІ МЕТОДИ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ			
4.4.1	якісний рентгенівський фазовий аналіз	de	Qualitative R[ol]ntgenphaseanalyse	*
		en	qualitative X-ray phase analysis	
		fr	analyse de phases qualitative [a4] rayons X	*
		ru	качественный рентгеновский фазовый анализ	

	Визначення природи кристалічних фаз мінералів зразка за характерним для кожної фази набором ліній або піків - набором міжплощинних відстаней та інтенсивностей	Определение природы кристаллических фаз минералов образца по характерным для каждой фазы набором линий или пиков - набором межплоскостных расстояний и интенсивностей	
4.4.2	кількісний рентгеновський фазовий аналіз	de Qualitative R[ol]ntgenphasenanalyse en qualitative X-ray phase analysis fr analyse de phase quantitative [a4] rayons X ru количественный рентгеновский фазовый анализ	*
4.4.3	Визначення залежності інтенсивності дифракційного відбиття від кількості відповідної фази обчислення її процентного вмісту з урахуванням масового коефіцієнта вбирання речовин і кожної фази метод рентгеноструктурного аналізу	Определение зависимости интенсивности дифракционного отражения от количества соответствующей фазы и вычисление ее процентного содержания с учетом массового коэффициента поглощения вещества и каждой фазы de R[ol]ntgenstrukturanalyse en m[e2]thod of X-ray (diffraction) analysis fr methode d'analyse (structurale) aux rayons X ru метод рентгеноструктурного анализа	*
	Визначення кристалічної структури досліджуваної речовини, процесів, які пов'язані з перебудовою атомів у кристалічній ґратці, за дифракційною картиною, що виникає при розсіюванні рентгеновських променів кристалічною ґраткою	Определение кристаллической структуры исследуемого вещества, процессов, связанных с перестройкой атомов в кристаллической решетке, по дифракционной картине, возникающей при рассеивании рентгеновских лучей кристаллической решеткой	
4.4.4	метод рентгеноспектрального аналізу	ДСТУ Б А.1.1-8-94 de R[ol]ntgenspektralanalyse en method of analysis by X-ray spectrometry fr m[e2]thode d'analyse radio-spectrale ru метод рентгеноспектрального анализа	*
4.4.5	Визначення хімічного складу речовини за селекцією та реєстрацією рентгеновського характеристичного спектра, який випромінюється атомами при опромінюванні їх рентгеновськими променями метод додавання фази, що визначається	Определение химического состава веществ по селекции и регистрации рентгеновского характеристического спектра, испускаемого атомами при облучении их рентгеновскими лучами de Bestimmungsphasenzusatzverfahren en method of addition of a defined phase	

		fr m[e2]thode d'addition d'une phase [a4] d[e2]finir *	*
		ru метод добавления определяемой фазы	
	Визначення кількісного складу шляхом вимірювання відношення інтенсивностей дифракційних ліній шуканої фази та відомої	Определение количественного состава путем измерения отношений интенсивностей дифракционных линий искомой фазы и известной	
4.4.6	метод відношення інтенсивностей аналітичних ліній	de Methode des Verh[al]tnisses der Intensit[al]t der Analysenlinien *	*
		en intensity relation method of analytical lines	
		fr m[e2]thode des relations d'intersite des lignes analytiques	
		ru метод отношений интенсивности аналитических линий	
	Визначення приблизного вмісту кристалічних фаз шляхом вимірювання відношення інтенсивностей аналітичних ліній зразка, який складається тільки з кристалічних фаз	Определение приблизительного содержания кристаллических фаз путем измерения отношения интенсивностей аналитических линий образца, состоящего только из кристаллических фаз	
4.4.7	метод прямого вимірювання коефіцієнта вбирання	de Methode der Direktmessung des Absortionskoeffizientes	
		en direct method of measurement of the absortion factor	
		fr m[e2]thode de mesurage direct *	*
- 14 -			
		ДСТУ Б А.1.1-8-94	
		du coefficient d'absorption	
		ru метод прямого измерения коэффициента поглощения	
	Визначення відношення коефіцієнтів вбирання досліджуваного зразка і чистої фази, що визначається	Определение отношения коэффициента поглощения исследуемого образца и чистой определяемой фазы	
4.4.8	метод внутрішнього стандарту	de Innenstandardverfahren	
		en method of an interior standard	
		fr m[e2]thode d'un standard int[e2]rieur *	*
		ru метод внутреннего стандарта	
	Встановлення співвідношення фази, що визначається, та введеної стандартної фази за різницею інтенсивностей дифракційних відбитків	Установление соотношения определяемой фазы и введенной стандартной фазы по разности интенсивностей их дифракционных отражений	
4.4.9	визначення напружень	de Beanspruchungsbestimmung	
		en voltage definition	
		fr d[e2]finition de tensions *	*
		ru определение напряжений	
	Метод побудований на прецезійному визначенні параметрів ґратки	Метод основан на прецезионном определении параметров решетки	
4.4.10	метод дослідження поверхні і тонких	de Method der Untersuchung der Oberfl[al]che und D[u]lnn-	*

плівок	filme
	en testing method of the surface and the fine films
	fr m[e2]thod d'ectude de la surface et des films fins *
	ru метод исследования поверхности и тонких пленок
Метод, який дозволяє зміною кута падіння первинного пучка змінювати глибину проникнення рентгенівських променів у зразок	Метод, позволяющий изменением угла падения первичного пучка изменять глубину проникновения рентгеновских лучей в образец
4.4.11 метод дослідження при різних температурах	de Method der Untersuchung bei Differenztemperaturen
	en testing method at different temperatures
	fr m[e2]thod d'etude aux temperatures diff[e2]rentes *
	ru метод исследования при раз-
	личных температурах
	Спосіб вивчення кінетики високо- і низькотемпературних реакцій в спеціальних високо- і низькотемпературних камерах з подальшою реєстрацією відбитків рентгенівських променів при заданих температурних параметрах
	Способ изучения кинетики высоко- и низкотемпературных реакций в специальных высоко- и низкотемпературных камерах с последующей регистрацией отраженных рентгеновских лучей при заданных температурах
4.4.12 метод дослідження при різних тисках	de Methode der Untersuchung bei Differenzdrucken
	en testing method at different pressures
	fr m[e2]thode d'etude aих pressures diff[e2]r[e2]ntes *
	ru метод исследования при различных давлениях
	Исследование полиморфных превращений, определение сжимаемости вещества, исследование реакций, проходящих в гидротермальных условиях
4.4.13 метод Лауе	de laue-Method
	en Lower's method
	fr m[e2]thode de Lower
	ru метод Лауэ
	Съемка неподвижного монокристалла в параллельном полихроматическом луче
4.4.14 метод обертання і коливання кристала	de Methode der Kristalldrehung und Schwingung
	en method of crystal rotation and vibration
	fr m[e2]thode de rotation et de vibration du crystal *
	ru метод вращения и колебания кристалла
Зйомка кристала при	Съемка кристалла при ко-

	коливанні навколо осі, перпендикулярної до первинного монохроматичного пучка	лебании вокруг оси, перпендикулярной к первичному монохроматическому пучку	
4.4.15	визначення товщини матеріалу	de Stoffdiskenbestimmung en definition of thickness material fr d[e2]finition del'[e2]pai-	*

- 16 -

		ДСТУ В А.1.1-8-94 sieur d'un materiau	
		ru определение толщины материала	
	Визначення інтенсивності випромінювання, яке пройшло крізь досліджуваний матеріал	Измерение интенсивности излучения, прошедшего через исследуемый материал	
4.4.16	локальний фазовий аналіз	de Lokale Phasenanalyse en local phase analysis fr analyse de phase locale ru локальный фазовый анализ	
	Дослідження фазового складу в малих ділянках при використанні первинного пучка малого перерізу діаметром 100 мкм	Исследование фазового состава в малых областях при использовании первичного пучка малого сечения диаметром 100 мкм	
4.4.17	метод порошку	de Pulververfahren en powder method fr m[e2]thode de poudre ru метод порошка	
	Вимірювання відбиття монохроматичних рентгенівських променів від зразка з розмірами кристалів від 5 до 40 мкм	Измерение отражений монохроматических рентгеновских лучей от образца с размерами кристаллов от 5 до 40 мкм	
4.4.18	метод дослідження при малих кутах	de Kleinwinkeluntersuchungsverfahren en test method with small angles fr m[e2]thode d'[e2]tude avec petits angles ru метод исследования при малых углах	*
	Фазовий аналіз речовини при кутових поворотах зразка і детектора в межах від декількох хвилин до градусів	Фазовый анализ вещества при угловых поворотах образца и детектора в пределах от нескольких минут до градусов	
4.4.19	стандартна речовина	de Standardstoff en standard matter fr mat[e2]re standard ru стандартное вещество	*
	Речовина, яка відтворює рентгенограму, що незалежна від умов і ступеня помолу та не схильна до склоутворення	Вещество, дающее рентгенограмму, не зависящую от условий и степени помола и не склонное к стеклообразованию	
4.4.20	деформація кристалу	de Kristallitdeformation	

- 17 -

		ДСТУ В А.1.1-8-94 en crystallite defomation fr d[e2]formation de la cristallite ru деформация кристаллита	*
--	--	--	---

4.4.21	Зміна параметрів елементарної комірки під дією мікронапружень параметр комірки	Изменение параметров элементарной ячейки под действием микронапряжений de Kammerparameter en cellular parameter fr param[e2]tre d'un cellule * ru параметр ячейки
4.4.22	Міжплощинні відстані для ряду ліній з відомими індексами відбиття максимум дифракційного піка	Межплоскостные расстояния для ряда линий с известными индексами отражений de Diffraktionspitzenmaximum en maximum diffraction peak fr valeur maximale du point de diffraction ru максимум дифракционного цикла
4.4.23	Вимірювання інтенсивності дифракційного цикла в точках, розділених проміжком 2-5, визначення центру тяжіння еталонна речовина	Измерение интенсивности дифракционного пика в точках, разделенных промежутком 2-5, определение центра тяжести de Standardsubstanz en reference substance fr substance [e2]talon * ru эталонное вещество
4.4.24	Речовина, для якої точно відома величина параметрів елементарної комірки коефіцієнт послаблення	Вещество, для которого точно известна величина элементарной ячейки de Schw[al]chungsfactor * en weakening factor fr facteur d'affaiblissement ru коэффициент ослабления
4.4.25	Зменшення інтенсивності рентгенівського пучка при проходженні його крізь шар речовини розмиття дефракційного піка	Ослабление интенсивности рентгеновского пучка при прохождении его через слой вещества de Diffraktionsspitzentr[ul]bung * en smearing of a diffraction peak fr an[e2]antissement d'une pointe * de diffraction ru размытие дифракционного пика
4.4.26	Сукупність факторів (дисперсність зразка, несувора монохроматичність випромінювання, наявність мікронапружень та ін.), які зумовлюють нечітку конфігурацію піків дифузне розсіювання під малими кутами	Совокупность факторов (дисперсность образца, нестрогая монохроматичность излучения, наличие микронапряжений и т.д.), вызывающих нечеткую конфигурацию пиков de Kleinwinkelzerstreuung en diffuse seattering under small sized angles * fr dispersion diffuse [a4] petits angles ru диффузное рассеивание под малыми углами
	Дифузне розсіювання, яке обумовлене неоднорідністю електронної густини на відстанях того самого порядку, кристалів, які склада-	Диффузное рассеивание, обусловленное неоднородностью электронной плотности на расстояниях того же порядка, кристаллов, построенных из крупных

ються з великих молекул, в яких періоди ідентичності на два порядки перевищують довжину хвилі випромінювання	молекул, в которых периоды идентичности на два порядка превышают длину волны излучения
4.4.27 інтенсивність розсіювання об'єктом	de Objektzerstreungsintensit[al]t* en diffusion intensity with an object fr intensit[e2] de diffusion avec* un objet ru интенсивность рассеивания объектом
Добуток числа частинок об'єкта, які беруть участь у розсіюванні, на інтенсивність розсіювання однієї частинки	Произведение числа частиц об'єкта, участвующих в рассеивании, на интенсивность рассеивания одной частицы
4.4.28 аналітична лінія	de Analysenlinie en analytical line fr linge analytique ru аналитическая линия
Лінія мінералу, вільна від накладання і з відомим значенням величини міжплощинної відстані	Линия минерала, свободная от наложений и с известным значением величины межплоскостного расстояния

- 19 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

аналіз рентгенівський фазовий кількісний	4.4.2
аналіз рентгенівський фазовий якісний	4.4.1
аналіз фазовий локальний	4.4.16
вибір випромінювання	4.2.19
визначення напружень	4.4.9
визначення товщини матеріалу	4.4.15
відхилення кута повороту блоку дефектування допустиме ...	4.2.2
детектор рентгенівського випромінювання	4.3.6
детектор телевізійного типу	4.3.7
деформація кристалу	4.4.20
джерело рентгенівського випромінювання	4.3.11
дифрактометр загального призначення	4.1.2
дифрактометр рентгенівський	4.1.1
дифрактометр рентгенівський малокутовий	4.1.4
дифрактометр рентгенівський текстурний	4.1.3
діапазон аналізуючих хімічних елементів	4.2.16
діапазон кутових переміщень	4.2.3
діапазон переміщення рентгенівської трубки	4.2.4
діапазон повороту досліджуваного зразка	4.2.10
діапазон робочих кутів гоніометричної приставки	4.2.6
інтенсивність розсіювання об'єктом	4.4.27
камера рентгенівська	4.3.5
канал рентгенівський спектрометричний	4.3.1
канал рентгенівський спектрометричний сканувальний	4.3.3
канал рентгенівський спектрометричний фіксований	4.3.2
коефіцієнт послаблення	4.4.24
комплекс керуючий дифрактометричний	4.3.12
комплекс рентгенівський аналітичний	4.1.7
контрастність рентгенівського дифрактометра	4.2.13
кристал-аналізатор	4.3.8
кристал-монокроматор	4.3.9
крок склонування мінімальний	4.2.18
кут відбору рентгенівського випромінювання	4.2.15
лінія аналітична	4.4.28
максимум дифракційного піка	4.4.22

межа виявлення	4.2.14
метод відношення інтенсивностей аналітичних ліній	4.4.6
метод внутрішнього стандарту	4.4.8
метод додавання фази, що визначається	4.4.5
метод дослідження поверхні і тонких плівок	4.4.10
метод дослідження при малих кутах	4.4.18
метод дослідження при різних температурах	4.4.11
метод дослідження при різних тисках	4.4.12
метод Лауе	4.4.13
метод обертання і коливання кристала	4.4.14
метод порошку	4.4.17
метод прямого вимірювання коефіцієнта вбирання	4.4.7
метод рентгеноспектрального аналізу	4.4.4
метод рентгеноструктурного аналізу	4.4.3
параметр комірки	4.4.21
площа вхідного вікна детектора робоча	4.2.11
похибка апаратурна основна	4.2.1
похибка вимірювання кута повороту	4.2.8
похибка кутового пристрою	4.2.7

- 20 -

ДСТУ В А.1.1-8-94

приставка рентгенівська гоніометрична	4.3.4
речовина еталонна	4.4.23
речовина стандартна	4.4.19
роздільність кутова	4.2.9
роздільність спектральна	4.2.17
розмиття дифракційного піка	4.4.25
розсіювання під малими кутами дифузне	4.4.26
спектрометр рентгенівський	4.1.5
спектрометр рентгенівський кристал-дифракційний	4.1.6
фільтр рентгенівський	4.3.10
швидкість установочна	4.2.5
швидкість лічення імпульсів на аналітичній лінії	4.2.12

- 21 -

ДСТУ В А.1.1-8-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

Abtastungs[ol]ntgenspektrometerkanal	4.3.3	*
Allgemeinzweckdiffraktometer.....	4.1.2	
Analysenleitungimpulsz[al]hlungsgeschwindigkeit	4.2.12	*
Analysenlinie	4.4.28	
Beanspruchungsbestimmung	4.4.9	
Beharrungsgeschwindigkeit	4.2.5	
Bereich der gepr[ul]ften chemischen Elemente.....	4.2.16	*
Bestimmungsphasenzusatzverfahren	4.4.5	
Detektoreingangs[ol]fnungsarbeitsfl[al]che	4.2.11	*
Diffraktometersteueranlage	4.3.12	
Diffraktionspitzenmaximum	4.4.22	
Diffraktionspitzentr[ul]bung	4.4.25	*
Drehwinkelmessfehler	4.2.8	
Fernsehdetektor.....	4.3.7	
Fixierr[ol]htgenspektrometerkanal	4.3.2	*
Gamma-Kristallspektrometer	4.1.6	
Geratefehler	4.2.1	
Innenstandardverfahren	4.4.8	
Kammerparameter	4.4.21	
Kleinwinkelr[ol]ntgendiffraktometer	4.1.4	*
Kleinwinkeluntersuchungsverfahren	4.4.18	
Kleinwinkelzerstreuung	4.4.26	
Kristallanalysator	4.3.8	
Kristallitdeformation	4.4.20	
Kristallmonochromator	4.3.9	
Laue Method	4.4.13	
Lokale Phasenanalyse	4.4.16	
Methode der Direktmessung des Absorptionskoeffizientes .	4.4.7	

Methode der Kristalldrehung und Schwingung	4.4.14	
Methode der Untersuchung bei Differenzdrucken	4.4.12	
Methode der Untersuchung bei Differenztemperatur	4.4.11	
Methode der Untersuchung der Oberfl[al]che und D[ul]nnfilme	4.4.10	*
Methode der Verh[al]tnisses der Intensit[al]t der Analysenlinien	4.4.6	*
Mindestastungssehrift	4.2.18	
Nachweisbarkeitsgrenze	4.2.14	
Objektzerstreuungsintensit[al]t	4.4.27	*
Pr[ul]fk[ol]rperdrehbereich	4.2.10	*
Pr[ul]winkelberiech des metrischen Vorsatzger[al]tes ...	4.2.6	*
Pulververfahren	4.4.17	
Qualitative R[ol]ntgenphasenanalyse	4.4.1	*
Quantitative R[ol]ntgenphasenanalyse	4.4.2	*
R[ol]ntgenanalysentkomplex	4.1.7	*
R[ol]ntgendiffraktometer	4.1.1	*
R[ol]ntgendiffraktometerkontrast	4.2.13	*
R[ol]ntgenfilter	4.3.10	*
R[ol]ntgengoniometervorsatzger[al]t	4.3.4	*
R[ol]ntgenkamera	4.3.5	*
R[ol]ntgenrohreverschiebungsbereich	4.2.4	*
R[ol]ntgenspektralanalyse	4.4.4	*
R[ol]ntgenspektrometer	4.1.5	*
R[ol]ntgenspektrometerkanal	4.3.1	*
R[ol]ntgenstrahlungsdetektor.....	4.3.6	*
R[ol]ntgenstrahlungsquelle	4.3.11	*

- 22 -

ДСТУ В А.1.1-8-94

R[ol]ntgenstrukturanalyse	4.4.3	*
Schw[al]chungsfaktor	4.4.24	*
Spektralaufteilung	4.2.17	
Standardstoff	4.4.19	
Standardsubstanz	4.4.23	
Stoffdiskenbestimmung	4.4.15	
Strahlungsauswahl.....	4.2.19	
Textur[ol]ntgendiffraktometer.....	4.1.3	*
Winkelanfl[ol]sung (Winkelaufteilung)	4.2.9	
Winkelfehler.....	4.2.7	
Winkelstrahlungsauswahlwinkel	4.2.15	
Winkelverschiebungsbereich	4.2.3	
Zulassige Abweichung des Drehiwinkels des Gleichrichtungsblockes	4.2.2	

- 23 -

ДСТУ В А.1.1-8-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

analutical line	4.4.28	
angular bloc error	4.2.7	
angular resolution	4.2.9	
angular of extraction of the X-radiation	4.2.15	
cellular parameter	4.4.21	
coating rate of impujses nn analytical line.....	4.2.12	
contrast of a X-ray diffractometer.....	4.2.13	
crystal-analyser	4.3.8	
crystal diffraction X-ray spectrometer	4.1.6	
crystal-monochromator	4.3.9	
crystallite deformation	4.4.20	
definition oi thickness material.....	4.4.15	
defection limit	4.2.14	
diffractometric control complex-KYD	4.3.12	
diffuse scattering under small sized angles	4.4.26	
diffusion intensity with an object.....	4.4.27	
direct method of measurement of the absorption factor	4.4.7	

displacement range of a X-ray tube	4.2.4
fixed spectrometric X-ray channel	4.3.2
general puppose diffractometer.....	4.1.2
input window working area the detector	4.2.11
intensity relation method of analytical lines.....	4.4.6
local phase analysis.....	4.4.16
Lower's method.....	4.4.13
main instrumental error	4.2.1
maximum diffraction peak.....	4.4.22
measurement erroe of a rotation angle	4.2.8
method of addition of a defined phase.....	4.4.5
method of analysis by X-ray spectrometry	4.4.4
method of an interior standart.....	4.4.8
method of crystal rotation and vibration	4.4.14
method of X-ray (diffraction) analysis	4.4.3
minimum step of scanning	4.2.18
powder method.....	4.4.17
qualitative X-ray phase analysis	4.4.1
quanitative X-ray phase analysis	4.4.2
radiation sampling	4.2.19
range of angular displacements	4.2.3
range of the analysed chemical elements	4.2.16
regulation speed	4.2.5
reference substance	4.4.23
rotation range of a testing sample	4.2.10
scanning spectrometric X-ray channel	4.3.3
small angle X-ray diffractometer	4.1.4
smearing of a diffraction peak	4.4.25
standart matter.....	4.4.19
source of X-ray-radiation.....	4.3.11
spectracal resolution	4.2.17
spectrometric X-ray channel	4.3.1
television type detector	4.3.7
testing method at different pressions	4.4.12
testing method at different temperatures	4.4.11
testing method of the surface and the fine films.....	4.4.10
test method with small angles	4.4.18
texture X-ray diffractometer	4.1.3

- 24 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

turning angle admissible deviation of the detection	
block	4.2.2
voltage definition	4.4.9
weakening factor.....	4.4.24
working angle range of a metric adapter.....	4.2.6
X-ray analytical complex	4.1.7
X-ray camera	4.3.5
X-ray diffractometer	4.1.1
X-ray filter	4.3.10
X-ray goniometry adapter.....	4.3.4
X-ray radiation detector	4.3.6
X-ray spectrometer	4.1.5

- 25 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

adapteur gomiométrique [a4] rayons X	4.3.4	*
analyse de phase locale.....	4.4.16	
analyse de phases qualitative [a4] rayons X	4.4.1	*
analyse de phase quantitative [a4] rayons X	4.4.2	*
an[e2]antissement d'une pointe de diffraction	4.4.25	*
angle d'extraction de la radiation X	4.2.15	*
cadence de comtage des impulsions sur ligne		
analytique	4.2.12	
canal de balayage spectrométrique [a4] rayons X	4.3.3	*

canal spectrometrique [a4] rayons X	4.3.1	*
canal spectrometrique, fixe [a4] rayons X	4.3.2	*
chambre de diffraction	4.3.5	
choix de radiation	4.2.19	
complexe analytique [a4] rayons X	4.1.7	*
complexe de commande diffractom[e2]trique	4.3.12	*
contraste d'un diffractometre [a4] rayons X	4.2.13	*
cristal-analyseur	4.3.8	
cristal-mnnochromateur	4.3.9	
d[e2]finition de l'[e2]paisseur d'un materiau	4.4.15	*
d[e2]finition de tensions	4.4.9	*
d[e2]formation de la cristallite	4.4.20	*
d[e2]tecteur de radiation X	4.3.6	*
d[e2]tecteur de type-television	4.3.7	*
deviation angulaire admissible du bloc de		
d[e2]tection	4.2.2	*
diffractometre [a4] rayons X	4.1.1	*
diffractometre [a4] rayons X [a4] petits angles	4.1.4	*
diffractometre de texture [a4] rayons X	4.1.3	*
diffractometre d'usage general	4.1.2	
dispersion diffuse [a4] petite angles	4.4.26	*
erreur de mesurage d'un angle de rotation	4.2.8	
erreur d'un bloc angulaire	4.2.7	
erreur principale due aux insrtumets	4.2.1	
facteur d'affaiblissement	4.4.24	
liltre [a4] rayons X	4.3.10	*
gamme de d[e2]placement d'un tube radiog[e2]n	4.2.4	*
gamme de rotation d'un [e2]chantillon [a4] [e2]tudier ..	4.2.10	*
gamme des angles de travail d'un adapteur		
m[e2]trique	4.2.6	*
gamme des d[e2]placements angulaires	4.2.3	*
gamme des elements chimiques analyser	4.2.16	
intensit[e2] de diffusion avec un objet	4.4.27	*
limite de d[e2]tection	4.2.14	*
linge analytique	4.4.28	
mati[e2]re standard	4.4.19	*
m[e2]thode d'addition d'une phase [a4] d[e2]finir	4.4.5	*
m[e2]thode d'analyse radiospectrale	4.4.4	*
m[e2]thode d'analyse (strycturale) aux rayons X	4.4.3	*
m[e2]thode de Lower	4.4.13	*
m[e2]thode de mesurage direct du coefficient		*
d'absorption	4.4.7	
m[e2]thode de poudre	4.4.17	*
m[e2]thode de rotation et de vibration du crystal	4.4.14	*
m[e2]thode des relations d'inteesite des lignes		*
analytiques	4.4.6	
m[e2]thode d'[e2]tude aux pressions diff[e2]rentes	4.4.12	*
- 26 -		
ДСТУ Б А.1.1-8-94		
m[e2]thode d'[e2]tude aux temperatures diff[e2]rentes ..	4.4.11	*
m[e2]thode d'[e2]tude avec petite angles	4.4.18	*
m[e2]thode d'[e2]tude de la surface et des films fins ..	4.4.10	*
m[e2]thode d'un standard int[e2]rieur	4.4.8	*
param[e2]tre d'un cellule	4.4.21	*
pas minimal de balayage	4.2.18	
r[e2]solution angulaire	4.2.9	*
r[e2]solution spectrale	4.2.17	*
source de rayonnement	4.3.11	
spectrom[e2]tre [a4] rayons X.....	4.1.5	*
spectrom[e2]tre de diffraction [a4] cristal [a4]		*
rayons X	4.1.6	
substance [e2]talon	4.4.23	*
surface utile de la lucarne d'entr[e2]e du		*
d[e2]tecteur	4.2.11	*

valeur maximale du point diffraction	4.4.22
vitesse de r[e2]glage	4.2.5 *

- 27 -

ДСТУ В А.1.1-8-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

анализ рентгеновский фазовый количественный	4.4.2
анализ рентгеновский фазовый качественный	4.4.1
анализ фазовый локальный	4.4.16
вещество стандартное	4.4.19
вещество эталонное	4.4.23
выбор излучения	4.2.19
детектор рентгеновского излучения	4.3.6
детектор телевизионного типа	4.3.7
деформация кристаллита	4.4.20
диапазон анализируемых химических элементов	4.2.16
диапазон перемещения рентгеновской трубки.....	4.2.4
диапазон поворота исследуемого образца	4.2.10
диапазон рабочих углов гониометрической приставки	4.2.6
диапазон угловых перемещений	4.2.3
дифрактометр общего назначения.....	4.1.2
дифрактометр рентгеновский	4.1.1
дифрактометр рентгеновский малоугловой.....	4.1.4
дифрактометр рентгеновский текстурный.....	4.1.3
интенсивность рассеивания объектом	4.4.27
источник рентгеновского излучения	4.3.11
камера рентгеновская	4.3.5
канал рентгеновский спектрометрический	4.3.1
канал рентгеновский спектрометрический сканирующий	4.3.3
канал рентгеновский спектрометрический фиксированный	4.3.2
комплекс рентгеновский аналитический	4.1.7
комплекс управляющий дифрактометрический	4.3.12
контрастность рентгеновского дифрактометра	4.2.13
коэффициент ослабления	4.4.24
кристалл-анализатор.....	4.3.8
кристалл-монокроматор	4.3.9
линия аналитическая	4.4.28
максимум дифракционного пика	4.4.22
метод внутреннего стандарта	4.4.8
метод вращения и колебания кристалла	4.4.14
метод добавления определяемой фазы	4.4.5
метод исследования поверхности и тонких пленок	4.4.10
метод исследования при малых углах	4.4.18
метод исследования при различных давлениях.....	4.4.12
метод исследования при различных температурах	4.4.11
метод Лауэ	4.4.13
метод отношений интенсивности аналитических линий	4.4.6
метод порошка	4.4.17
метод прямого измерения коэффициента поглощения	4.4.7
метод рентгеноспектрального анализа	4.4.4
метод рентгеноструктурного анализа	4.4.3
определение напряжений	4.4.9
определение толщины материала	4.4.15
отклонение угла поворота блока дефектирования	
допустимое	4.2.2
параметр ячейки	4.4.21
площадь входного окна детектора рабочая.....	4.2.11
погрешность аппаратурная основная	4.2.1
погрешность измерения угла поворота	4.2.8
погрешность углового устройства	4.2.7
предел обнаружения.....	4.2.14
приставка рентгеновская гониометрическая	4.3.4

- 28 -

ДСТУ В А.1.1-8-94

размытие дифракционного пика.....	4.4.25
-----------------------------------	--------

разрешение спектральное	4.2.17
разрешение угловое	4.2.9
рассеивание под малыми углами диффузное	4.4.26
скорость счета импульсов на аналитической линии.....	4.2.12
скорость установочная	4.2.5
спектрометр рентгеновский	4.1.5
спектрометр рентгеновский кристалл-дифракционный	4.1.6
угол отбора рентгеновского излучения.....	4.2.15
фильтр рентгеновский	4.3.10
шаг сканирования минимальный	4.2.18

Ключові слова: аналітична лінія, визначення, кристал-аналізатор, кристал-монохроматор, коефіцієнт послаблення, межа виявлення, похибка, рентгенівський аналіз, рентген-камера, спектрометр, термін, швидкість.

Примітка.

*/ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів

